



بررسی و مقایسه دو روش تداخل سنجی جابجایی فاز و تبدیل فوریه در اندازه‌گیری مورفولوژی سطوح

سیاوش باقری، محمدرضا جعفر فرد و محمدحسین مهدیه

دانشگاه علم و صنعت ایران، نارمک، تهران، ایران

چکیده - در این مقاله، دو روش تداخل‌سنجی برای اندازه‌گیری مورفولوژی سطح مورد بررسی قرار داده شده است. نمونه شبیه‌سازی در نظر گرفته‌شده برای این مطالعه، یک توری پراش ۶۰۰ خط در میلی‌متر بود. طرح تداخلی برای این نمونه شبیه‌سازی شد و روش‌های تبدیل فوریه و جابجایی فاز برای استخراج نمایه سطح نمونه از این طرح تداخلی بکار گرفته شد. کدهای مربوط به هر کدام از روش‌ها در نرم‌افزار متلب نوشته شد و سپس با استفاده از پردازش تصویر عددی، نمایه سطح به دست آمده از هر یک از روش‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. نتایج نشان می‌دهد که در سیستم‌های ایده‌آل با نوفه بسیار کم، مقدار خطای اندازه‌گیری مورفولوژی در روش جابجایی فاز نسبت به روش تبدیل فوریه کمتر است. همچنین نشان داده می‌شود که حساسیت روش تبدیل فوریه به تغییرات نوفه نسبت به روش جابجایی فاز کمتر است و این روش برای سیستم‌های با نوفه زیاد نسبت به روش جابجایی فاز ارجحیت دارد.

کلید واژه- نمایه سنجی سطوح، نقشه سطح، تداخل‌سنجی جابجایی فاز، تداخل سنجی تبدیل فوریه

An Investigation on Surface Morphology Measurement Based on Fourier Transform and Phase Shifting Method

Bagherie, Siavash; Jafarfard, Mohammad Reza; Mahdih Mohammad Hossein

Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran

Abstract- In this paper, two interferometric methods for surface morphology measurement has been investigated. The simulated sample considered for this study was a diffraction grating with 600 lines per millimeter. A simulated interference pattern for this sample was created and Fourier transform and phase shifting methods have been utilized for the extracting surface profile from that of interference pattern. The code for each method has been written in MATLAB and by using numerical image processing, the obtained surface profile for each method was analyzed. The results demonstrate that in the ideal systems with low percentage of noise the morphological error in phase shifting method is less than Fourier transform method. However, sensitivity of Fourier transform to noise variation is less than phase shifting method and it is recommended to use this method for the noisy systems.

Keywords: 3-D surface profiling, map of surface, phase shifting interferometry, Fourier transform interferometry

۱- مقدمه

و $\phi(x, y)$ اختلاف فاز بین دو موج است. برای استخراج $\phi(x, y)$ روش‌های مختلفی از جمله جابجایی فازی، تبدیل فوریه وجود دارد که در ادامه به معرفی این روش‌ها می‌پردازیم.

۱-۲- نمایه سنجی جابجایی فازی

تداخل سنج جابجایی فاز بیش از سه دهه است که برای اندازه‌گیری‌های دقیق اپتیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش برای بازسازی جبهه موج حداقل به سه طرح تداخلی ضبط شده با فازهای متفاوت نیاز است. با تغییر فاز، شدت در خروجی تداخل سنج به وسیله رابطه زیر داده می‌شود:

$$I(x, y) = a(x, y)[1 + b(x, y) \cos(\phi(x, y) + \delta_n)] \quad (2)$$

که δ_n جابجایی فاز است.

الگوریتم‌های متعددی برای استخراج $\phi(x, y)$ از معادله (۲) پیشنهاد شده است که ما الگوریتم چهار پله‌ای را برای این کار انتخاب کرده‌ایم. در این الگوریتم جابجایی فاز به اندازه $\frac{\pi}{2}$ است.

$$\begin{aligned} I_1(x, y) &= a(x, y)[1 + b(x, y) \cos(\phi(x, y))] \\ I_2(x, y) &= a(x, y)[1 + b(x, y) \cos(\phi(x, y) + \pi/2)] \\ I_3(x, y) &= a(x, y)[1 + b(x, y) \cos(\phi(x, y) + \pi)] \\ I_4(x, y) &= a(x, y)[1 + b(x, y) \cos(\phi(x, y) + 3\pi/2)] \end{aligned} \quad (3)$$

با حل این چهار معادله فاز جبهه موج به صورت زیر به دست می‌آید:

$$\phi(x, y) = \tan^{-1} \left(\frac{I_1 - I_3}{I_2 - I_4} \right) \quad (4)$$

و نمایه سطح $h(x, y) = \frac{4\pi}{\lambda} \phi(x, y)$ خواهد بود [۶].

۲-۲- نمایه سنجی تبدیل فوریه

نمایه سنجی تبدیل فوریه یکی از روش‌های اندازه‌گیری سه‌بعدی رایج اپتیکی است که فقط به یک طرح تداخلی برای به دست آوردن سطح نمونه نیاز دارد. یک الگوی تداخلی (فریز) سینوسی می‌تواند به صورت زیر بیان شود:

$$g(x, y) = a(x, y) + b(x, y) \cos[2\pi f_0(x + y) + \phi(x, y)] \quad (5)$$

در صنعت، برای سرعت بخشیدن به توسعه تولید و اطمینان از کیفیت محصول، نیاز به اندازه‌گیری دقیق نمایه سطوح وجود دارد. نمایه سنجی سه‌بعدی سطح با کاربردهایی در زمینه‌های مدرن مانند نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی و اپتوالکترونیک برای صنایع تولیدی با فناوری بالا بسیار مهم است. روش‌های مختلف میکروسکوپی، مکانیکی و اپتیکی برای اندازه‌گیری سطوح پیشنهاد شده است. از بین این روش‌ها، روش‌های اپتیکی به دلیل مزیت‌هایی مانند غیر تماسی بودن، دقت و سرعت زیاد و ارزان بودن مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. تداخل سنجی، تکنیک ماره، اسکن لیزری و فتوگرامتری^۱ از جمله روش‌های متداول نمایه سنجی اپتیکی می‌باشد [۴-۱].

در این مقاله از روش تداخل سنجی که در بین روش‌های اپتیکی سریع‌تر می‌باشد برای نمایه سنجی سه‌بعدی سطح مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای معرفی مزیت‌ها و معایب روش‌های تداخل سنجی، دو روش مهم جابجایی فاز و روش تبدیل فوریه، به وسیله شبیه‌سازی عددی مورد بررسی و مقایسه قرار می‌دهیم.

۲- مبانی نظری

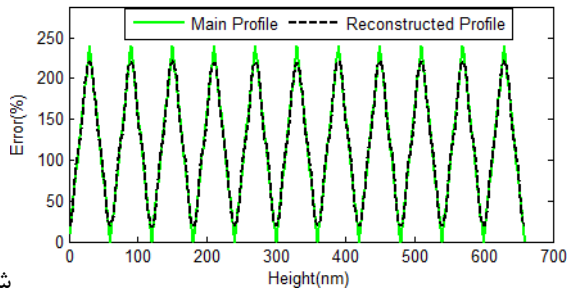
در روش تداخل سنجی نور فرودی به دو قسمت تقسیم می‌شود که یکی از آن‌ها بر روی نمونه فرود می‌آید و دیگری بدون تماس با نمونه به صورت نور مرجع وارد دوربین می‌شود. طرح تداخلی بر روی حسگر دوربین تشکیل می‌شود. اختلاف فاز مرجع و نمونه با استفاده از پردازش تصویر طرح تداخلی به دست می‌آید. اختلاف فاز، ناشی از تغییرات ارتفاع می‌باشد [۵]. تداخل بین دو موج با طول موج یکسان توزیع شدت زیر را نتیجه می‌دهد:

$$I(x, y) = a(x, y)[1 + b(x, y) \cos(\phi(x, y))] \quad (1)$$

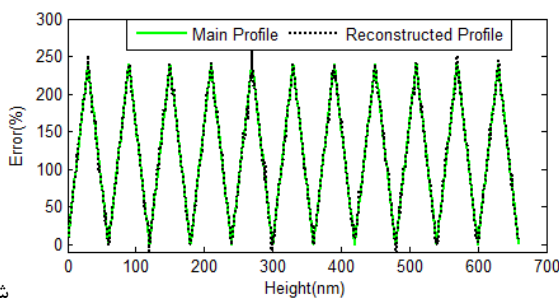
که $a(x, y)$ شدت پس‌زمینه، $b(x, y)$ نمایانی (مرئیت) فریز

همان طور که از شکل (۲) دیده می شود تبدیل فوری نقاط بسیار تیز را به خوبی نمی تواند بازسازی کند ولی در بقیه نقاط خطای اندکی دارد. همچنین در شکل (۳) همین نمایه با روش جابجایی فاز بازسازی شده است.

با تغییر ارتفاع ناهمواری های سطح، مقدار خطا نیز تغییر می کند که این تغییرات در شکل (۴) برای دو



شکل (۲) نمایه بازسازی شده با تبدیل فوری (رنگ مشکی) و نمایه اصلی (رنگ سبز)



شکل (۳) نمایه بازسازی شده با جابجایی فاز (رنگ مشکی) و نمایه اصلی (رنگ سبز)

طول موج ۵۳۲ nm و ۶۳۲ nm به ازای مقدار ثابت سیگنال به نوفه با روش تبدیل فوری نشان داده شده است.

همچنین این تغییرات برای روش جابجایی فاز در شکل (۵) آورده شده است. با مقایسه شکل (۴) و شکل (۵) می توان نتیجه گرفت که برای نمونه هایی با ناهمواری های کمتر از ۱۰۰ nm خطای روش تبدیل فوری نسبت به روش جابجایی فاز کمتر است و همچنین با افزایش ارتفاع ناهمواری ها خطای روش جابجایی فاز کاهش می یابد در حالی که در روش تبدیل فوری با افزایش ارتفاع ناهمواری ها، خطا حالت نوسانی دارد و در یک نقطه خطا به مینیمم مقدار خود می رسد.

که $\varphi(x, y)$ فاز شامل اطلاعات شکل، $a(x, y)$ شدت (نور) پس زمینه، $b(x, y)$ دامنه تابع کسینوسی و f_0 فرکانس حامل است.

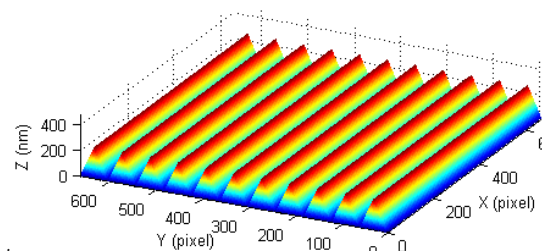
با اعمال فرمول اوپلر به فرمول (۵) و سپس با گرفتن تبدیل فوری دوبعدی از رابطه حاصله به دست می آوریم:

$$G(f_x, f_y) = A(f_x, f_y) + C(f_x - f_0, f_y - f_0) + C^*(f_x + f_0, f_y + f_0) \quad (6)$$

سه جمله ی رابطه (۶) در حوزه فرکانس فضایی از هم جدا شده اند. یک فیلتر مناسب برای جدا کردن $C(f_x - f_0, f_y - f_0)$ اعمال می شود سپس با لگاریتم گرفتن از تبدیل فوری معکوس $C(f_x - f_0, f_y - f_0)$ فاز $\varphi(x, y)$ به دست می آید [۷].

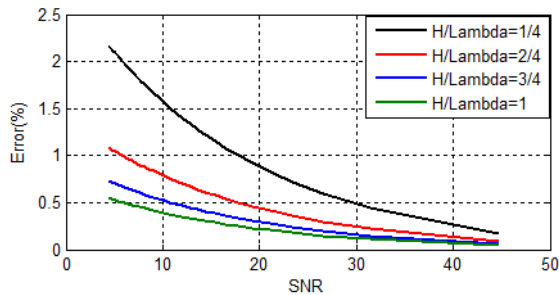
۳- نتایج

نمونه مورد بررسی در این مقاله یک توری پراش ۶۰۰ خط در میلی متر است که ۱۱ خط از آن مانند شکل (۱) مورد بررسی قرار داده شده است.



شکل (۱) توری پراش ۶۰۰ خط در میلی متر طراحی شده

نمایه سطح با دو روش تبدیل فوری و جابجایی فاز بازسازی شده است. برای تعیین حساسیت هر کدام از روش ها به نوفه، مقداری نوفه تصادفی با توزیع پواسون به شدت داخلی I اضافه شده است. شکل (۲) نمایه بازسازی شده به روش تبدیل فوری را در مقایسه با نمایه اصلی سطح نشان می دهد که با نسبت سیگنال به نوفه (SNR) ۲۰ به دست آمده است.



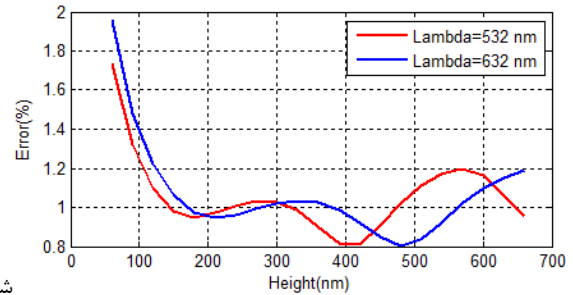
شکل (۷) تغییرات خطا برحسب SNR با روش جابجایی فاز

۴- نتیجه‌گیری

در این مقاله، دو روش مهم نمایه‌سنجی سطوح با نرم‌افزار متلب شبیه‌سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. میزان خطا برای دو روش تبدیل فوریه و جابجایی فاز به ازای نوفه‌های مختلف محاسبه شده است. نتایج نشان می‌دهد که مقدار خطای اندازه‌گیری نمایه سطوح در روش جابجایی فاز در سیستم‌های ایده‌آل با نوفه بسیار کم نسبت به روش تبدیل فوریه کمتر است. همچنین نشان داده شد که تغییرات مقدار خطا به تغییرات نوفه در روش تبدیل فوریه با شیب بسیار کم است و این روش برای سیستم‌های با نوفه زیاد توصیه می‌شود.

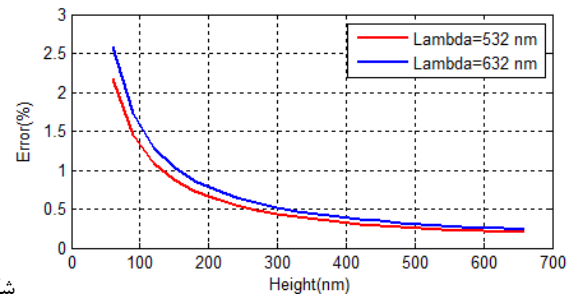
مراجع

- [1] Chen, F., G.M. Brown, and M. Song, *Overview of three-dimensional shape measurement using optical methods*. Optical Engineering, 2000. 39(1): p. 10-22.
- [2] Choi, Y.-B. and S.-W. Kim, *Phase-shifting grating projection moiré topography*. Optical Engineering, 1998. 37(3): p. 1005-1010.
- [3] Keferstein, C.P. and M. Marxer, *Testing bench for laser triangulation sensors*. Sensor Review, 1998. 18(3): p. 183-187.
- [4] Wang, L.-S. and S. Krishnaswamy, *Shape measurement using additive-subtractive phase shifting speckle interferometry*. Measurement Science and Technology, 1996. 7(12): p. 1748.
- [5] Sirohi, R., *Optical methods of measurement: wholefield techniques*. 2009: CRC Press.
- [6] Malacara, D., *Optical shop testing*. Vol. 59. 2007: John Wiley & Sons.
- [7] Su, X. and W. Chen, *Fourier transform profilometry: a review*. Optics and lasers in Engineering, 2001. 35(5): p. 263-284.



شک

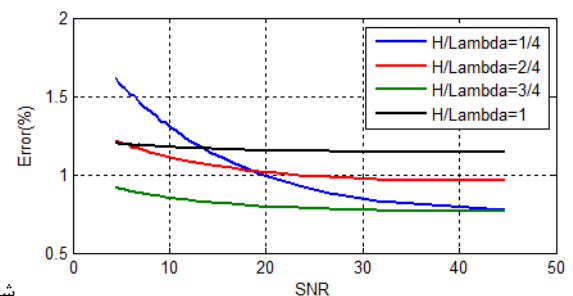
ل (۴) تغییرات خطا برحسب ارتفاع ناهمواری‌ها با روش تبدیل فوریه



شک

ل (۵) تغییرات خطا برحسب ارتفاع ناهمواری‌ها با روش جابجایی فاز

همچنین تغییرات خطا برحسب SNR برای چهار ارتفاع مختلف با طول موج ۶۳۲nm برای روش تبدیل فوریه و جابجایی فاز به ترتیب در شکل (۶) و (۷) آورده شده است. با مقایسه دو شکل (۶) و (۷) مشاهده می‌شود که در محدوده سیگنال به نوفه کم، خطای اندازه‌گیری مورفولوژی در روش فوریه نسبت به روش جابجایی فاز کمتر است که می‌توان نتیجه گرفت که روش تبدیل فوریه به تغییرات نوفه نسبت به جابجایی فاز کمتر حساس است و در محیط‌های با نوفه زیاد توصیه می‌شود از روش فوریه استفاده شود.



شک

ل (۶) تغییرات خطا برحسب SNR با روش تبدیل فوریه